

営業案内

株式会社 JEL



● 目次	2
● 会社概要	3
● ISO/IEC 17025 認定試験所	4
● サービス内容	5
● 試験所のご案内 我孫子テストサイト	8
● 試験所のご案内 テクニカルセンター	6
● 料金規定 EMC 試験	10
● お申し込み手続き EMC 試験	13
● アジア向けサービス	14
● 料金規定 アジア向けサービス	15
● 校正サービス	16

● 会社概要

社名 株式会社 JEL
会社設立 2011 年 7 月 18 日
代表取締役兼 CEO 北川 翔
従業員数 18 名 (2017 年 11 月現在)

● 事業拠点所在地

本社
〒105-0014 東京都港区芝 3-42-10 三田 UT ビル 8F
TEL 03-3452-1056 / FAX 03-6826-8682

我孫子テストサイト (予約・各種問い合わせ窓口)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠 2971
TEL 04-7188-6381 / FAX 04-7188-6382

テクニカルセンター
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠 3032
TEL 04-7188-5333 / FAX 04-7188-5320

● 事業内容

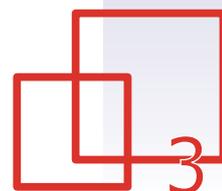
- EMC (電磁両立性) Testing and Certification
- EMC に関する各種コンサルテーション
(認証申請代行、ISO/IEC 17025 認定取得、製品安全)
- ISO/IEC 17025 に基づく認定校正

● 加入団体

一般財団法人 VCCI 協会賛助会員
電波環境協議会会員
社団法人関西電子工業振興センター (KEC) 会員

● 品質保証

ISO/IEC 17025 認定試験所
2003 年 8 月台湾 BSMI 認定取得



ISO/IEC 17025 認定試験所

当社では、クライアントの皆様にご提供する、各種試験結果の品質維持と信頼性の一層の向上のため、試験所運営の国際基準である ISO/IEC 17025 に基づいた主要国の認定機関による認定を取得しています。これらの認定機関の裏書きを得ることで、世界のあらゆる地域に対して、今まで以上に通用性の高い試験レポートをご提供できるものと確信しております。

* 認定範囲等詳細につきましてはお問い合わせください。



- **FCC ファイリング、VCCI 登録済み**
当社の所有するすべてのオープンサイトとシールドルームは、米国 FCC (米国連邦通信委員会) へファイリング、および VCCI (一般財団法人 VCCI 協会) へ登録されています。
- **その他業務提携**
当社は下記試験機関と業務提携しています。また、規格の動向や試験法など、常に最新の情報を入手し、明確なサービスを提供できるよう、日々努めております。
- **IECEE CB-SCHEME**
IECEE CB-SCHEME の正式な試験ラボとして、2005 年に認可されました。
TÜV Rheinland Japan 株式会社との協力により、CB-SCHEME に則った EMC 試験を実施する事が可能です。
- **TÜV Rheinland Japan 株式会社**
TÜV Rheinland による安全性試験と EMC 試験をご利用のお客様には、より効率的な EMC マーク取得業務の提供が可能です。

サービス内容

- **エミッション測定 (EMI) 測定対応項目**
適用規格 : IEC/EN 60601-1-2, 61000-6-3, -6-4, EN 55011, 55014-1, 55032, 61326-1
CISPR 11, 14-1, 32, FCC Part 15, CNS 13438, VCCI, 電気用品安全法
他、主要なエミッション規格
電界強度測定 (9kHz-18GHz 3, 10, 30m)
磁界強度測定 (9kHz-30MHz)
雑音端子電圧測定 (9kHz-30MHz)
吸収クランプ法輻射電力測定 (30-300MHz)
電源高調波電流測定 (50Hz-2kHz, IEC/EN 61000-3-2, -3-12)
電源電圧変動 & フリッカ測定 (IEC/EN 61000-3-3, -3-11)
- **イミュニティ試験 (EMS) 試験対応項目**
適用規格 : IEC/EN 60601-1-2, 61000-6-1, -6-2, EN 55014-2, 55024, 61326-1
CISPR 14-2, 24, JIS T 0601-1-2
他、主要なイミュニティ規格
静電気放電試験 (IEC/EN 61000-4-2)
放射性 RF 電磁界試験 (IEC/EN 61000-4-3)
EFT/ バースト試験 (IEC/EN 61000-4-4)
サージ試験 (IEC/EN 61000-4-5)
RF 伝導性コモンモード試験 (IEC/EN 61000-4-6)
電源周波数電磁界試験 (IEC/EN 61000-4-8)
電圧ディップ・瞬断・変動試験 (IEC/EN 61000-4-11)
- **アジア認証申請代行サービス (製品認証 ; EMC/ テレコム / 製品安全)**
中国サンプリングテストサービス
EMC 試験 / EMC 予備試験 / EMC 現地試験アレンジメント
製品安全試験アレンジメント
認証申請代行
翻訳業務
認証申請におけるコンサルティング業務およびサポート
海外認証に関する調査
- **校正サービス**
2006 年 10 月米国 A2LA 認定を取得
ISO/IEC 17025 に基づいた EMC 関連機器の校正をご提供

試験所のご案内 我孫子テストサイト

- 試験設備 オープンサイト 3 基
シールドルーム 3 基
- 対応項目 電界強度測定 (9kHz-18GHz 3, 10, 30m)、磁界強度測定 (9kHz-30MHz)
雑音端子電圧測定 (9kHz-30MHz)、吸収クランプ法輻射電力測定 (30-300MHz)
電源高調波電流測定 (50Hz-2kHz)、電源電圧変動 & フリッカ測定
- 対応規格 国際規格 : IEC 61000-6-3, -6-4, CISPR 11, CISPR 14-1, CISPR 22, CISPR 32
IEC 60601-1-2, IEC 61326-1, IEC 61000-3-2, -3-3
欧州規格 : EN 55011, EN 55014-1, EN 55022, EN 55032, EN 60601-1-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12,
EN 61000-6-3, 61000-6-4
米国規格 : FCC Part 15 using ANSI C63.4, FCC Part 18
カナダ規格 : ICES-003
豪州 /NZ 規格 : AS/NZS CISPR 11, 14.1, 22, AS/NZS 61000.3.2, 61000.3.3
国内規格 : VCCI, 電波法, 電気用品安全法
その他、主要なエミッション規格
- 依頼測定 一部エミッション測定において、依頼測定を行っています。

● 測定設備仕様

● オープンサイト

施設名称	TT 直径	耐荷重	搬入口 (W x H)	EUT 用電源	対応試験項目
1号サイト	2.4m	350kg	2.1 x 1.98m	単相 0-240V, 50/60Hz, 20A	3 & 10m 電界強度 磁界強度
2号サイト	3.0m	350kg	2.1 x 2.35m	単相 0-240V, 50/60Hz, 30A	3 & 10m 電界強度 磁界強度
8号サイト	5.0m	4t	3.0 x 2.55m 最大 W3.37m まで可	単相 0-240V, 50Hz, 16kVA 0-240V, 60Hz, 16kVA 三相 Δ200V, 50Hz, 150kVA Y400V, 50Hz, 100kVA 50/60Hz, 48kVA	10 & 30m 電界強度 磁界強度

● シールドルーム

施設名称	内寸	搬入口 (W x H)	EUT 用電源	対応試験項目
1号	6.3 x 5.4 x H2.5	1.5 x 2.15m	単相 0-240V, 50/60Hz, 20A	雑音端子電圧
2号	6.3 x 5.4 x 2.5	1.5 x 2.15m	単相 0-240V, 50/60Hz, 30A	雑音端子電圧 高調波 & フリッカ
6号	5.0 x 6.7 x H3.1	1.40 x 2.05m * リフター寸法 1.35 x 2.15 x 1.60(D)	単相 0-240V, 50/60Hz, 30A 0-288V, 5-1100Hz, 6kVA	雑音端子電圧 EMI プリ & ポスト・ スキャンング

試験所のご案内 テクニカルセンター

- 試験設備 6面電波暗室 3基
EN試験室(イミュニティ専用シールドルーム) 1基
- 対応項目 静電気放電試験、放射性 RF 電磁界試験、EFT/バースト試験、サージ試験
RF 伝導性コモンモード試験、電源周波数磁界試験、電圧・ディップ瞬断試験
- 対応規格 国際規格 : IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, CISPR 14-2, CISPR 24
IEC 60601-1-2, IEC 61326-1
欧州規格 : EN 61000-6-1, -6-2, EN 50130-4, EN 55014-2, EN 55024
EN 60601-1-2, EN 61326-1
国内規格 : JIS T 0601-1-2, JIS C 1806-1, JIS C 61000-6-2, JEIDA-52
その他主要なイミュニティ規格

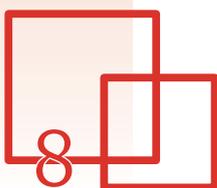
● 試験設備仕様

設備名称	第1電波暗室 (AR-1)	第2電波暗室 (AR-2)	第3電波暗室 (AR-3)	EN試験室
内寸	10.5 x 6.9 x H7.0m	8.0 x 3.4 x H3.2	8.0 x 3.4 x H3.2	7.0 x 5.1 x H2.7
TT直径	4.8m	***	1.8m	***
耐荷重	3.5t	500kg	350kg	500kg
搬入口	2.4 x 2.5H	1.5 x 2.0H	1.5 x 2.0H	1.55 x 2.2
EUT用電源	単相 0-288V, 5-1100Hz, 6kVA 三相 Δ 200V, 50Hz, 100kVA Y 400V, 50Hz, 100kVA	単相 0-240V, 50Hz, 30A 三相 Δ 200V, 50Hz, 100kVA Y 400V, 50Hz, 12kVA	単相 0-240V 50Hz, 30A	単相 0-288V, 5-1100Hz, 6kVA 三相 Δ 200V, 50Hz, 100A Y 0-498V, 5-1100Hz 18kVA, 400V 50Hz, 35kVA
対応試験項目	イミュニティ ①~⑧	イミュニティ ②、③	EMI プリ & ポスト・ スキャンング	イミュニティ ①、④~⑧ 高調波 & フリッカ

*EUT用リフト : 耐荷重 500kg、サイズ W2.0 x D1.5m

* 高調波測定は相電流 30A 以下 (単相 / 三相)、フリッカ測定は相電流 40A 以下のみ対応しています。

* 対応試験項目番号については、次頁試験仕様参照



試験項目 基本規格	試験仕様	主な EUT 電源仕様
①静電気放電 IEC/EN 61000-4-2	出力電圧：0.2-30kV, 極性：正負 放電抵抗：150Ω&330Ω, 結合板：水平 & 垂直 充電コンデンサ：150pF 放電形式：気中放電 & 接触放電	単相交流：0-288V, 5-1100Hz, 6kVA 三相交流：0-498V, 5-1100Hz, 6kVA (相), Y 三相交流：400V, 50Hz, 100kVA, Y 三相交流：200V, 50Hz, 100kVA, Δ
②放射性 RF 電磁界 (AM 変調) IEC/EN 61000-4-3 ENV 50140	周波数：10kHz-6GHz, 偏波：水平 & 垂直 試験レベル：3m 距離で 1-10V/m (0.5 で最大 200V/m) 均一性：20MHz-2.7GHz で 6dB 以内保証 変調：無変調あるいは 1kHz80%AM 変調	単相交流：0-288V, 5-1100Hz, 6kVA 三相交流：0-498V, 5-1100Hz, 6kVA (相), Y 三相交流：400V, 50Hz, 100kVA, Y 三相交流：200V, 50Hz, 100kVA, Δ
③放射性 RF 電磁界 (パルス変調) ENV 50204	周波数：900±5MHz (26MHz-3GHz 内の任意周波数可) 繰返周期：200Hz (1μHz-2MHz 内の任意周波数可) デューティ：50% (5-95% 内、0.1% ステップで可変可能) 立ち上がり立ち下がり時間：平均で 1μs。(可変不可)	単相交流：0-288V, 5-1100Hz, 6kVA 三相交流：0-498V, 5-1100Hz, 6kVA (相), Y 三相交流：400V, 50Hz, 100kVA, Y 三相交流：200V, 50Hz, 100kVA, Δ
④EFT/バースト IEC/EN 61000-4-4	開回路出力電圧：0.2-4.5kV 繰返し周波数：1Hz-1MHz, 極性：正負 バースト持続時間：0.01-20ms バースト周波数：1-400Hz 結合方法：CDN&容量性クランプ	単相交流：0-250V, 30A 三相交流：0-498V, 150A
⑤サージ IEC/EN 61000-4-5	結合波：1.2/50μs, 8/20μs 開回路電圧：0.5-4kV (1.2/50μs) 短絡回路電流：0.25-2.0kA (8/20μs) 極性：正負	単相交流：0-250V, 16A 三相交流：0-498V, 150A 通信線：PSTN/ISDN (up to 4-wire) 10/700μs, 1.2/50μs
⑥RF 伝導性 コモンモード IEC/EN 61000-4-6 ENV 50141	周波数：150kHz-230MHz 試験レベル：1-10V 変調：1kHz 80% AM 変調、パルス変調 結合方法：CDN, EM-Clamp, Current Clamp, Direct	単相交流：0-250V, 50/60Hz, 50A 三相交流：0-440V, 100A CDN: S1, S4, S8, M1 ~ 5, T2, T4, T8
⑦電源周波数磁界 IEC/EN 61000-4-8	周波数：16.7/50/60Hz, DC 試験レベル：1-100A/m (Continuous mode) 誘導コイルサイズ：最大高さ 3m, 幅制限無し 印加軸：X, Y, Z	単相交流：0-288V, 40Hz-1kHz, 6kVA 三相交流：0-498V, 40Hz-1kHz, 6kVA, Y 三相交流：400V, 50Hz, 100kVA, Y 三相交流：200V, 50Hz, 100kVA, Δ
⑧電圧ディップ ・瞬断・変動 IEC/EN 61000-4-11	ドロップアウト時間：非同期 200μs-2147s, 同期 200μs-655s 繰返し時間：非同期 500μs-2147s, 同期 1-65535 半波 試験間隔：1s-80h, もしくは連続 平均スイッチング時間：立ち上がり 1μs, 立ち下がり 2μs	単相交流：0-288V, 15-400Hz, 16A 三相交流：0-460V, 50/60Hz, Y (30A/Line)
性能劣化および誤動作判定用機器	電話機および交換機等の音響自動評価システム、CRT 等の ジッタ評価用マイクロスコープ等	

* 試験仕様は、予告なしに変更することがあります。

料金規定 EMC 試験

本料金規定は、都合により変更することがあります。ご利用前に必ずご確認くださいませようお願い致します。

● 施設利用料金

利用設備	平日基本料金 (税別) (9:00-11:45 / 12:45-17:00)	平日超過料金 / 時間 (税別)
電波暗室	¥360,000-	¥60,000-
EN 試験室	¥260,000-	¥40,000-
オープンサイト + シールドルーム	¥260,000	¥40,000-

* 弊社休日 (土、日、祝祭日) のご利用は、上記料金の一律 25% 割増となります。

* 複数の設備を並行してご利用される場合は、それぞれの料金の合計となります。

* 11:45-12:45 は昼食休憩時間となっております。

● 依頼測定

適用規格	測定項目	測定周波数	基本料金 (税別)
VCCI	電界強度 雑音端子電圧	30MHz-1GHz 1GHz 以上 150kHz-30MHz	¥60,000- ¥60,000- ¥30,000-
FCC Part 15 ICES-003	電界強度 雑音端子電圧	30MHz-1GHz 1GHz 以上 150kHz-30MHz	¥60,000- ¥60,000- ¥30,000-
EN CISPR	電界強度 雑音端子電圧 雑音電力	30MHz-1GHz 1GHz 以上 150kHz-30MHz 30MHz-300MHz	¥60,000- ¥60,000- ¥30,000- ¥60,000-
電気用品安全法	電界強度 雑音端子電圧	30MHz-1GHz 526.5kHz-30MHz	¥60,000- ¥30,000-
IEC/EN 61000-3-2 JIS C 61000-3-2	高調波電流		¥60,000-
IEC/EN 61000-3-3	フリッカ	Pst Plt マニュアルスイッチング	¥60,000- ¥60,000- ¥60,000-

* 上記依頼測定は、1 機種 1 モードの料金です。同一装置で複数のモードを測定する場合は、追加モードあたり、基本料金の 75% を加算させていただきます。

なお、動作サイクルが長い場合や連続動作しない場合は、別途お見積もりさせていただきます。

* 記載以外の規格は、別途お見積もりさせていただきます。

* 測定日のご指定はできません。測定完了まで 7 日以内を目安としてください。

* 2 時間のフリッカ Plt 測定を希望される場合は、1 測定につき ¥20,000- (税別) を加算させていただきます。

* 重量物や操作が複雑な装置については、依頼測定をお受けできない場合がございます。この場合は、立ち会い測定でのご利用をお願いします。

* 高調波 & フリッカの依頼測定は、当面入力電流が 16A 以下の単相交流機器のみに適用させていただきます。

試験報告書

種別	種類	料金	
エミッション 高調波 & フリッカ	裏書付試験報告書	正 1 部	¥30,000-
		写 1 部につき	¥3,000-
	裏書無試験報告書	正 1 部	¥20,000-
		写 1 部につき	¥2,000-
	PDF データ (CD-R)	写 1 部につき	¥10,000-
イミュニティ	裏書付試験報告書	正 1 部	¥40,000-
		写 1 部につき	¥4,000-
	裏書無試験報告書	正 1 部	¥30,000-
		写 1 部につき	¥3,000-
	PDF データ (CD-R)	写 1 部につき	¥10,000-

* 電源高調波電流および電源電圧変動 & フリッカの試験報告書は、電界強度 / 端子電圧の EMI 試験報告書とは別扱いとし、1 適用規格の料金として扱います。

*「裏書付」とは、公的な認定機関により認可された範囲内に限り、認定機関のエンブレム入りで発行することのできる試験報告書を意味します。

* お客様のご都合により試験報告書の再発行をご依頼される場合は、上記規定料金の 50% を上限とし、再発行料金を申し受ける場合がございます。

貸出機器 (エミッション測定のみ)

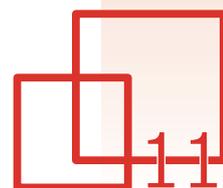
貸出機器	1 台あたりの貸出料金 / 日 (税別)
パーソナルコンピュータ	¥20,000
周辺機器	¥5,000

重量料金

装置の総重量が 300kg を超える場合は、超過 100kg につき ¥10,000- (税別) の重量料金を日ごとに加算させていただきます。

TCF 取扱い業務 & 技術相談料金

項目	料金 (税別)
TCF 取扱手数料	¥300,000-/ 機種
CB への技術相談料	¥25,000-/ 時間
弊社との技術相談料	¥15,000-/ 時間



● キャンセル料金

● キャンセルする日数の合計が 4 日までの場合

キャンセルを申し出た日	キャンセル料金
ご利用日の 10 日以前	無料
ご利用日の 9-7 日前まで	基本料金の 25%
ご利用日の 6-4 日前まで	基本料金の 50%
ご利用日の 3 日前から当日	基本料金の 100%

● キャンセルする日数の合計が 5 日以上の場合

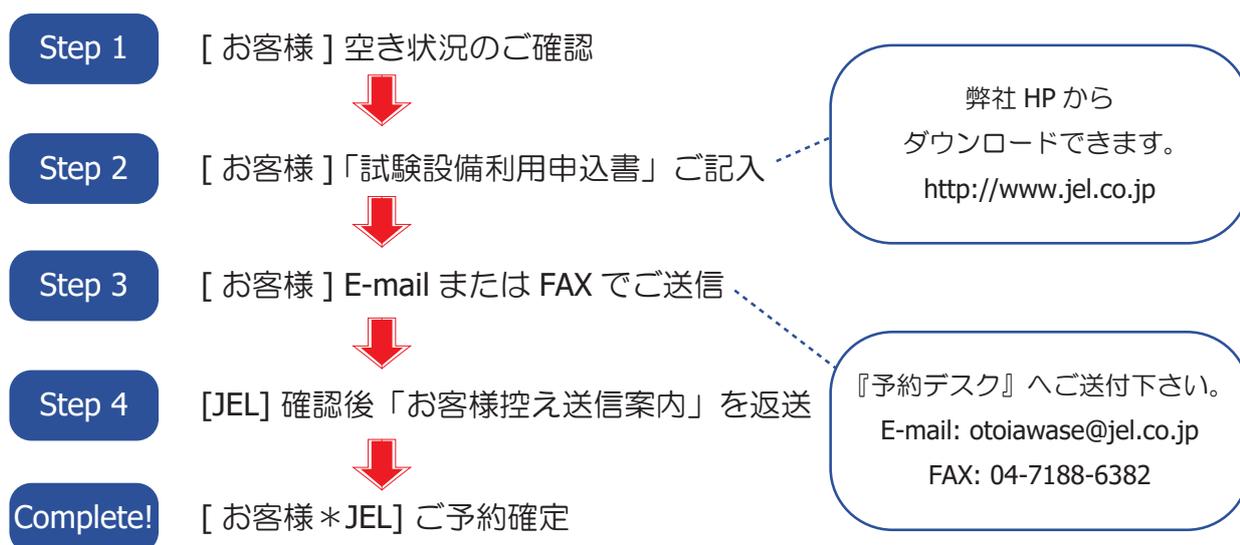
キャンセルを申し出た日	キャンセル料金
ご利用日の 40 日以前	無料
ご利用日の 39-20 日前まで	基本料金の 10%
ご利用日の 19-10 日前まで	基本料金の 25%
ご利用日の 9-7 日前まで	基本料金の 50%
ご利用日の 6-4 日前まで	基本料金の 75%
ご利用日の 3 日前から当日	基本料金の 100%

* キャンセル料金は、キャンセルする日数 x 基本料金 x 上記比率で算出させていただきます。

* ご利用日までの日数計算の際には、弊社休日（土、日、祝祭日）は日数としてカウント致しません。

* ご予約日の変更も、キャンセルの対象とさせていただきます。

お申し込み手続き EMC 試験



● 注意事項

- 事前に利用設備の空き状況をご確認のうえ、『試験設備利用申込書』に必要事項を記入して E-mail または FAX でお申し込みください。弊社にて内容を確認のうえ、お客様控えとして写しを返送致します。
- お客様のお手元に『試験設備利用申込書』の写しが届き次第、正式予約となります。
- 仮予約は原則行っておりません。
- 予約の取り消しや日程の変更等の受付は、弊社営業時間内（平日午前 9 時～午後 5 時）とさせていただきます。規定期日内の取り消しや日程変更は、規定のキャンセル料金を申し受けます。

● 装置の搬入搬出

- 装置の機密保持上、できる限りご利用当日に搬入ください。なお、大型装置の事前のお預かりは行っておりません。
- 装置の搬入搬出の運送費用は、お客様側のご負担とさせていただきます。
- 装置の搬出時に一般輸送業者を利用する場合は、業者への委託も含めて発送依頼を申し受けます。（着払い扱い）
- 装置の搬入は、弊社営業時間内とさせていただきます。なお、弊社休日の搬入および搬出は行っておりません。
- 我孫子サイト・テクニカルセンター間の移送に、弊社所有の 2t トラックをご利用いただけますが、装置の梱包、荷揚げ、積み下ろし等の作業は、お客様側に行って頂きます。

アジア向けサービス

● 認証取得 申請代行サービス

弊社では台湾のコンタクトポイントを拠点として、韓国・中国の試験所と業務提携を結び、EMC 試験 - 製品安全試験 - 認証取得までを効率よく、一括で行えるサービスを行っております。

● 台湾 : BSMI (TA, RPC, DoC) 認証、NCC 認証

● 韓国 : KC

● 中国 : CCC

(上記以外の認証については、お問い合わせください。)

● 台湾 BSMI 認定試験所

弊社は台湾の認定機関 BSMI の認定試験所ですので、以下の製品に関しては、弊社サイト (日本国内) のテストレポートが BSMI への申請時、利用可能です。

● IT 製品 (対応規格 : CNS 13438)

● ISM、電磁調理器具、電子レンジ (対応規格 : CNS 13803)

● 一般家庭用電気器具、電動工具 (対応規格 : CNS 13783-1)

● 中国サンプリングテストサービス

CCC 定期工場検査実施項目により、実施が義務付けられている中国現地工場でのサンプリング試験を、JEL 提携サイト (中国) で実施するサービスを行っております。お客様の現地工場の状況に合わせてご提案致します。詳しくはお問い合わせください。

● Full Assistance: 年 1 回の EMC 試験、試験手配一式および管理

● Semi Assistance: 年 1 回の EMC 試験および管理

● Spot Assistance: 初回の試験所案内のみ 等

● サービス項目

EMC 試験 / EMC 予備試験 / EMC 現地試験アレンジメント

製品安全試験アレンジメント

認証申請代行

翻訳業務

認証申請におけるコンサルティング業務およびサポート

海外認証に関する調査業務 等

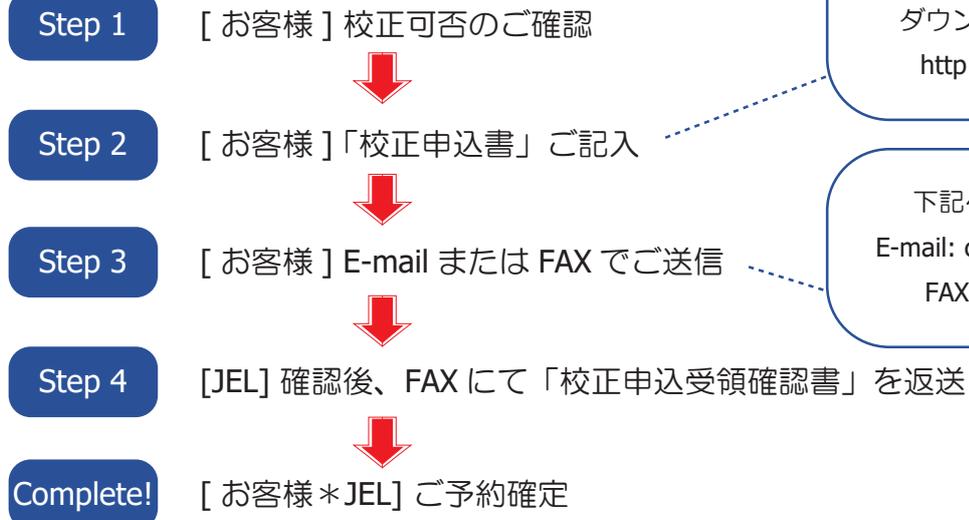
● 料金規定

お問い合わせください。

E-mail: otoiawase@jel.co.jp

校正サービス

● お申し込み手続き



● 注意事項

事前に校正の可否をご確認のうえ、『校正申込書』に必要事項を記入して E-mail または FAX でお申し込みください。弊社にて内容を確認のうえ、「校正申込受領確認書」を返送致します。

● 校正依頼品の輸送

- 校正依頼品の輸送費用は、お客様側のご負担とさせていただきます。
- 弊社休日の受取りおよび発送は行っておりません。

Calibration Service Menu 校正サービス一覧

Item to be calibrated 対象機器項目	Frequency 周波数他	Applicable Standard 適用規格他	Standard 一般校正	A2LA 認定校正	Availability of calibrations by manufacturers procedures 製造者 校正手順対応
Biconical Antenna バイコニカルアンテナ					
・Antenna Factor アンテナファクタ	30MHz - 1000MHz	ANSI C63.5:1998/2006 (3-antenna method by 3/10m)	○	○	-
	30MHz - 1000MHz	ANSI C63.5:1998/2006 (Identical antenna method by 3/10m)	○	○	-
	30MHz - 300MHz	ANSI C63.5:1998/2006 (Ref. antenna method by 10m)	○	○	-
・Antenna Balance アンテナ平衡度	30MHz - 300MHz	CISPR 16-1-4:2010+A1:2012 他	○	○	-
Log-periodic antenna ログペリオディックアンテナ					
・Antenna Factor アンテナファクタ	200MHz - 1000MHz	ANSI C63.5:1998/2006 (3-antenna method by 3/10m)	○	○	-
	200MHz - 1000MHz	ANSI C63.5:1998/2006 (Identical antenna method by 3/10m)	○	○	-
	300MHz - 1000MHz	ANSI C63.5:1998/2006 (Ref. antenna method by 10m)	○	○	-
・Cross-Polarization 交叉偏差	200MHz - 1000MHz	CISPR 16-1-4:2010+A1:2012 他	○	○	-
Hybrid antenna 複合アンテナ					
・Antenna Factor アンテナファクタ	30MHz - 1000MHz	ANSI C63.5:1998/2006 (3-antenna method by 3/10m)	○	-	-
・Antenna Balance 平衡度	30MHz - 300MHz	CISPR 16-1-4:2010+A1:2012 他	○	-	-
・Cross-Polarization 交叉偏差	200MHz - 1000MHz	CISPR 16-1-4:2010+A1:2012 他	○	-	-
Dipole antenna ダイポールアンテナ					
・Antenna Factor アンテナファクタ	30MHz - 1000MHz	ANSI C63.5:1998/2006 (Ref. antenna method by 10m)	○	○	-
Horn antenna ホーンアンテナ					
・Antenna Factor アンテナファクタ	1GHz - 18GHz	ANSI C63.5:1998/2006 (3-antenna method by 3/10m)	○	○	-
・Cross-Polarization 交叉偏差	1GHz - 18GHz	CISPR 16-1-4:2010+A1:2012 他	○	○	-

Active monopole antenna アクティブモノポールアンテナ					
・Antenna Factor アンテナファクタ	100kHz - 50MHz	CISPR 16-1-4:2010+A1:2012 他	○	○	-
LISN/AMN 疑似電源回路網					
・Voltage Division Factor 電圧分割係数	9kHz-1000MHz	CISPR 16-1-2:2014 他	○	○	-
・Impedance インピーダンス	9kHz-1000MHz	CISPR 16-1-2:2014 他	○	○	-
・Phase 位相	9kHz-30MHz	CISPR 16-1-2:2014 他	○	○	-
・Decoupling Factor 分離度	9kHz-1000MHz	CISPR 16-1-2:2014 他	○	○	-
・VSWR	9kHz-30MHz	CISPR 16-1-2:2014 他	○	○	-
ISN (製造メーカー校正キットでの校正: 対応機種 TESEQ / 協立電子工業 / Schwarzbeck / FCC 他)					
・Asymmetrical Impedance / Phase 不平衡インピーダンス / 位相	0.1MHz - 80MHz	CISPR 22:2008 他	○	○	○
・Voltage Division Factor 電圧分割係数	0.1MHz - 80MHz	CISPR 22:2008 他	○	○	○
・Insertion Loss 挿入損失	0.1MHz - 80MHz	CISPR 22:2008 他	○	○	○
・Decoupling Attenuation 減結合減衰量	0.1MHz - 80MHz	CISPR 22:2008 他	○	○	○
・Longitudinal Conversion Loss (LCL) 縦方向の変換損失	0.1MHz - 80MHz	CISPR 22:2008 他	○	○	○
・Longitudinal Conversion Loss (LCL) 縦方向の変換損失 (LCL キャリブレーション)	0.1MHz - 80MHz	CISPR 22:2008 他	○	○	○
・Asymmetric Attenuation 非対称の減衰 (LCL キャリブレーション)	0.1MHz - 80MHz	CISPR 22:2008 他	○	○	○
High-impedance probe ハイ・インピーダンスプローブ					
・Insertion Loss 挿入損失	9kHz - 30MHz	CISPR 22:2008	○	-	-
・Impedance インピーダンス	9kHz - 30MHz	CISPR 22:2008	○	-	-
Power Amplifier パワーアンプ					
・Gain アンプゲイン	30kHz-18GHz	JEL Calibration procedure (JEL 校正手順)	○	○	○
・Linearity 直線性	30kHz-18GHz	JEL Calibration procedure (JEL 校正手順)	○	○	○
・Harmonic Distortion 高調波特性	100kHz-1.8GHz	JEL Calibration procedure (JEL 校正手順)	○	○	○

Pre-amplifier プリアンプ					
・Gain アンプゲイン	30kHz-18GHz	JEL Calibration procedure (JEL 校正手順)	○	○	○
・Linearity 直線性	30kHz-18GHz	JEL Calibration procedure (JEL 校正手順)	○	○	○
・Harmonic Distortion 高調波特性	100kHz-1.8GHz	JEL Calibration procedure (JEL 校正手順)	○	○	○
Absorbing Clamp 吸収クランプ					
・Clamp Factor Original Cal. Method (従来法)	30-1000MHz	CISPR 16-1-3:2004, CISPR16-1-3, Corrigendum 1:2006	○	○	-
・Decoupling Factor DF/DR	30-300MHz	CISPR 16-1-3:2004, CISPR16-1-3, Corrigendum 1:2006	○	○	-
Capacitive Voltage probe 容量性電圧プローブ					
・CW Response (Voltage Division Factor) CW 特性 (電圧分割係数)	0.1MHz - 30MHz	CISPR 16-1-2:2014 他	○	○	-
・Pulse Response パルス応答特性	0.1MHz - 30MHz	CISPR 16-1-2:2014 他	○	○	-
・Relative Pulse Response パルス繰り返し周波数偏差	0.1MHz - 30MHz	CISPR 16-1-2:2014 他	○	○	-
・Decoupling 減結合	0.1MHz - 30MHz	CISPR 16-1-2:2014 他	○	○	-
CDN 結合減結合ネットワーク					
・Coupling factor 結合係数	0.1MHz - 230MHz	IEC 61000-4-6:2013 他	○	○	-
・Coupling Impedance (AE: Open/Short) 結合インピーダンス	0.1MHz - 230MHz	IEC 61000-4-6:2013 他	○	○	-
・Decoupling Impedance (AE: Open/Short) 減結合インピーダンス	0.1MHz - 230MHz	IEC 61000-4-6:2013 他	○	-	-
De-Coupling Network 減結合ネットワーク					
・Insertion Loss 挿入損失	0.1MHz - 230MHz	IEC 61000-4-6:2013 他	○	-	-
Burst tester + High voltage unit バーストテスター + 高電圧ユニット					
・Peak Voltage ピーク電圧	250V to 5kV	IEC 61000-4-4:2012	○	○	-
・Rise Time 立ち上がり時間	5ns	IEC 61000-4-4:2012	○	○	-

・Pulse Duration パルス長	50ns	IEC 61000-4-4:2012	○	○	-
・Pulse Repetition Frequency 繰り返し周波数	5kHz - 100kHz	IEC 61000-4-4:2012	○	○	-
・Burst Period	300ms	IEC 61000-4-4:2012	○	○	-
・Burst Duration バースト長	15ms & 0.75ms	IEC 61000-4-4:2012	○	○	-
Capacitive clamp 容量性クランプ					
・Output Open Circuit: Peak Voltage / Front Time / Duration	2kV	IEC 61000-4-4:2012	○	○	-
・Rise Time	5ns	IEC 61000-4-4:2012	○	○	-
・Pulse Duration	50ns	IEC 61000-4-4:2012	○	○	-
Surge simulator サージシミュレータ					
・Output Open Circuit: Peak Voltage / Front Time / Duration	0.5, 1, 2, 4kV	IEC 61000-4-5:2014 他	○	○	-
・Short Circuit: Peak Current/Front Time/Duration 短絡: ピークの流れ / 正面時間 / 期間	10A-2kA	IEC 61000-4-5:2014 他	○	○	-
・CDN Section Phase Shifting	-	IEC 61000-4-5:2014 他	○	○	-
EM Clamp EM クランプ					
・Coupling Factor 結合係数	0.1MHz - 230MHz	IEC 61000-4-6:2013 他	○	○	-
Current Injection Probe 電流注入プローブ					
・Insertion Loss 挿入損失	0.1MHz - 230MHz	IEC 61000-4-6:2013 他	○	○	-
50Ω Termination 50Ω 終端					
・Impedance インピーダンス	9kHz - 1.8GHz	JEL Calibration procedure (JEL 校正手順)	○	○	-
・VSWR 電圧反射係数	30kHz - 18GHz	JEL Calibration procedure (JEL 校正手順)	○	○	-
Magnetic Field strength Meter 磁界強度計					
・Magnetic field strength 磁界強度	50/60Hz	IEC 61000-4-8:2009 他	○	○	-

CISPR Pulse Generator パルス発生器					
・Impulse Area パルス面積	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015	○	○	-
・Impulse Bandwidth パルス幅	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015	○	○	-
・Null point Frequency ノルポイント周波数	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015	○	○	-
・Flatness of Spectrum Amplitude スペクトラムの均一性	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015	○	○	-
・Pulse Repetition Frequency パルス繰り返し周波数	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015	○	○	-
・Source Errors for Sinewave Output for CISPR Checks(@60dBuV) 正弦波出力ポート電圧確度 (60dBuV)	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015	○	○	-
EMI Receiver EMI レシーバ					
・Input Impedance 入力インピーダンス	CISPR Band A/B/C/D/E	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Pulse Response パルス振幅確度	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Relative Pulse Response パルス繰り返し周波数偏差	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Sine-wave Accuracy 正弦波振幅確度	CISPR Band A/B/C/D/E	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Selectivity (6dB Bandwidth) 総合選択度特性	CISPR Band A/B/C/D/E	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Intermediate Frequency Rejection Ratio 中間周波数抑圧比	CISPR Band A/B/C/D/E	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○

・Image Frequency Rejection Ratio 映像周波数抑圧比	CISPR Band A/B/C/D/E	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Spurious Frequency Rejection Ratio スプリアス周波数抑圧比	CISPR Band A/B/C/D/E	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Peak Detector Verification 尖頭値検波特性	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Average Detector Verification 平均値検波特性	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・RMS Detector Verification 実行値検波特性	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Response to Intermittent, Unsteady & Drifting Narrow band Disturbances 断続的不安定で且つ偏位する狭帯域妨害に対する応答	CISPR Band A/B/C/D	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Impulse Bandwidth Measurement (EMI Receiver & Spectrum Analyzer) 1MHz インパルス帯域幅測定	CISPR Band E	CISPR 16-1-1:2015 他 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
Signal Generator 信号発生器					
・Frequency Accuracy 周波数確度	9kHz-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Reference Frequency Accuracy 基準周波数確度	10MHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Level Accuracy 振幅確度	9kHz-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・AM Depth AM 変調度	1% - 100%	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○

・Attenuator Setting Accuracy アッテネータ設定確度	9kHz-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Harmonic Distortion 高調波特性	9kHz-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・AM Frequency 振幅変調周波数	20Hz – 100kHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
Fixed/Step attenuator, High/Low/Band pass filter, Coaxial switch, etc.					
・Insertion Loss 挿入損失	9KHz - 40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Reflection Coefficient 反射特性	30kHz - 18GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
Coaxial cable 同軸ケーブル					
・Cable loss ケーブルロス	9kHz - 40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
Spectrum analyzer スペクトラムアナライザ					
・10MHz Reference Frequency Accuracy 10MHz のレファレンス周波数確度	10MHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Marker Readout Accuracy マーカ表示精度	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Frequency Span Accuracy 周波数スパン確度	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Frequency Readout Accuracy 周波数読みとり確度	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Noise Sidebands ノイズ側波帯	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Spurious Responses スプリアス特性	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○

・Residual FM 残留 FM	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Display Scale Fidelity 表示スケール忠実度	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Input Attenuation Switching Uncertainty 入力アッテネータの切換確度 / 不確かさ	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Reference Level Accuracy 基準レベル確度	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Resolution Bandwidth Switching Uncertainty レゾリューションバンド幅の切換確度	DC-26.5GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Absolute Amplitude Accuracy 絶対振幅確度	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Resolution Bandwidth Accuracy レゾリューションバンド幅精度	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Residual Response 残留レスポンス	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Displayed Average Noise Level 表示平均ノイズレベル	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Frequency Response/Flatness 周波数レスポンス / 均一性	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Tracking Generator Level Flatness トラッキングジェネレータの均一性	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Overall Absolute Amplitude Accuracy 総合的な絶対のアンプリチュード精度	DC-40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Impulse Bandwidth Measurement 1MHz インパルス帯域幅測定	CISPR Band E	CISPR 16-1-1:2015 or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○

Digital Multimeter デジタルマルチメーター					
・DC voltage 直流電圧	1mV - 1000V	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順)	○	○	○
・AC voltage 交流電圧	1mV - 1000V	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順)	○	○	○
・DC current 直流電流	10 μ A - 36A	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順)	○	○	○
・AC current 交流電流	100 μ A - 60A	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順)	○	○	○
・Resistance 抵抗	100m Ω - 111.11M Ω	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順)	○	○	○
・Frequency 電源周波数	0.1Hz - 2MHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順)	○	○	○
Oscilloscope オシロスコープ					
・DC output	DC	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・AC output	DC-2GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Time Interval Accuracy	DC-2GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Input impedance	DC-2GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・DC Voltage Measurement Accuracy	DC	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Bandwidth	DC-2GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Trigger Sensitivity	DC-2GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Zero Error	DC-2GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Offset Gain	DC-2GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○

・DC Gain	DC	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
Click Generator クリック発生器					
・Click Amplitude クリック振幅確度	150kHz-30MHz	CISPR 16-1-1:2015	○	○	-
・Click Duration クリック時間	150kHz-30MHz	CISPR 16-1-1:2015	○	○	-
Click Analyzer クリックアナライザ					
・QP Amplitude	150kHz-30MHz	CISPR 16-1-1:2015	○	○	-
・Click Duration	150kHz-30MHz	CISPR 16-1-1:2015	○	○	-
S-Parameter Test Set S パラメータテストセット					
・Directivity 方向性	9kHz – 6GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Switch Repeatability 切り替えの繰り返し性	9kHz – 6GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
Network Analyzer ネットワークアナライザ					
・Frequency Accuracy 周波数確度	9kHz – 40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Level Accuracy / Level Flatness 振幅確度 / 振幅均一性	9kHz – 40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Power Linearity 振幅直線性	9kHz – 40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Harmonics 高調波	9kHz – 6GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Noise Level 雑音レベル	9kHz – 40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Cross Talk 漏信号	9kHz – 6GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○

・Input Impedance 入力インピーダンス	9kHz – 40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Absolute Amplitude Accuracy 絶対振幅確度	9kHz – 6GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Dynamic Accuracy ダイナミック確度	9kHz – 6GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
ESD Simulator 静電気発生器					
・Rise / Fall Time 立ち上がり時間	1kV – 15kV	IEC 61000-4-2:2008 他	○	○	-
・Peak Current / Current at 30/60 ms 頂電流 / 30/60 ミリ秒後の電流	1kV – 15kV	IEC 61000-4-2:2008 他	○	○	-
ESD Target 静電気発生器校正用的					
・Flatness and Measurement Chain 均一性と測定連鎖	30kHz – 4GHz	IEC 61000-4-2:2008 他	○	○	-
・Input Resistance 入力抵抗	DC	IEC 61000-4-2:2008 他	○	○	-
Dropout simulator ドロップアウトシュミレータ					
・Voltage 電圧	DC – 400Hz	IEC 61000-4-11:2004	○	○	-
・Phase Shifting 位相	DC – 400Hz	IEC 61000-4-11:2004	○	○	-
・Repetition Time 繰り返し時間	DC – 400Hz	IEC 61000-4-11:2004	○	○	-
・Event Time 継続時間	DC – 400Hz	IEC 61000-4-11:2004	○	○	-
・Rising and Falling Time 立上時間	DC – 400Hz	IEC 61000-4-11:2004	○	○	-
・Overshoot and Undershoot 突出電圧	DC – 400Hz	IEC 61000-4-11:2004	○	○	-
AC Power Source 交流電源					
・Frequency Accuracy 周波数確度	< 800Hz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Voltage Accuracy 電圧確度	1V - 700V	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○

・Distortion 歪	20Hz – 20kHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・In-Rush Current 突入電流	< 10kVA	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Supplying Capacity 供給容量	< 10kVA	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
DC Power Source 直流電源					
・Voltage Accuracy 電圧精度	1mV – 1000V	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Voltage Drop 電圧降下	DC	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Noise Level 雑音レベル	DC	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Output Current Accuracy 出力電流精度	100 μ A – 3A	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
Audio Generator / Function Generator 音響発生器 / 波形発生器					
・Frequency Accuracy (Sine-wave) 正弦波の周波数精度	1Hz – 2MHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Amplitude Accuracy (Sine-wave) 正弦波の振幅精度	3Hz – 300kHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Distortion (Sine-wave) 正弦波の歪	20Hz – 20kHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Rise and Fall Time (Rectangular and Triangle Wave) 方形波と三角波の立ち上がり時間	< 2MHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
・Voltage Accuracy 電圧精度	< 2MHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○

・Duty Cycle 繰り返し周期	< 2MHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	○
Open Area Test Site オープンサイト					
・NSA with Broad Band antenna 広帯域アンテナ NSA	30MHz - 1000MHz	ANSI C63.4:2014 他	○	○	-
・Site VSWR サイト定在波	1GHz - 18GHz	CISPR 16-1-4:2010+A1:2012	○	○	-
Current Probe 電流プローブ					
・Transfer Impedance 伝達インピーダンス	0.1MHz - 2100MHz	CISPR 16-1-2:2014	○	○	-
TV Analyzer テレビジョンアナライザ					
・Field Strength 電界強度	300MHz - 1000MHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	-
Directional Coupler 方向性結合器					
・Insertion Loss 挿入損失	9kHz - 40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順)	○	○	-
・VSWR 電圧反射特性	30kHz-18GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順)	○	○	-
・Coupling Factor 結合係数	9kHz - 40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順)	○	○	-
・Directivity 方向性	9kHz - 40GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順)	○	○	-
Coil 電環					
・Magnetic Field Level	40Hz - 800Hz	IEC 61000-4-8:2009 他	○	○	-
Power Sensor パワーセンサー					
・VSWR	9kHz - 18GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	-
・Insertion Loss 挿入損失	9kHz - 18GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	-
・Level Accuracy 振幅確度	9kHz - 18GHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	-

Power Meter パワーメーター					
・Zero Carryout	50MHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	-
・Instrument Accuracy	50MHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	-
・Reference Power	50MHz	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	○	-
Field monitor + Field probe フィールドモニタ + フィールドプローブ					
・Frequency response 周波数特性	80MHz-2.7GHz	IEC61000-4-3:2006	○	-	-
・Amplitude Linearity 振幅の直線性	80MHz-2.7GHz	IEC61000-4-3:2006	○	-	-
・Isotropic response アイソトロピック特性	80MHz-2.7GHz	IEC61000-4-3:2006	○	-	-
・Directivity 指向性	80MHz-2.7GHz	IEC61000-4-3:2006	○	-	-
Clamp Meter クランプメータ					
・DC current 直流電流	100 μ A – 500A	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	-	-
・AC current 交流電流	10 μ A – 500A	JEL Calibration Procedure (JEL 校正手順) or Manufacture's Procedure (メーカー校正手順)	○	-	-

QSES グループ
株式会社 JEL

本社 〒105-0014
東京都港区芝 3-42-10 三田 UT ビル 8F
TEL 03-3452-1056 FAX 03-6826-8682

我孫子テストサイト / 予約問い合わせ総合窓口 〒270-1121
千葉県我孫子市中峠 2971
TEL 04-7188-6381 FAX 04-7188-6382

テクニカルセンター 〒270-1121
千葉県我孫子市中峠 3032
TEL 04-7188-5333 FAX 04-7188-5320